

後記号なし

特許法第38条 ただし書の規定 による特許出籍

1. 発明の名称 アンブル、パイアル等の検査方式

2. 発許請求の範囲に記載された発明の数

者 サンスト サヤリン 東京都昭島市中神町1418番地 日本電子株式会社内

(ほか1名)

· (B)

4. 特許出顧人

東京都昭島市中神町 1418 香地 (TEL 0425 (43) 1111)

5. 近付書類の目録

(1)

1 通 1 36

特许户 49 6.14

## 公開特許公報

19 日本国特許庁

①特勝昭 51-20897

④公開日 昭51. (1976) 2.19

②特願昭 49-9284/

②出願日 昭49 (1974) 8. /3

審查請求 未請求 (全4頁)

庁内整理番号

6860 24 2172 23

52日本分類

113 DZ iii FZ

60 Int. C12

GOIN 21/28

アンプル。ペイアル等の検査方式

- 1 アンブル。パイアル等の容器内に存在する具 物を検査するにあたり、その全検差工程を二つ の主要部分に分離し、第1の工程において、ア ・ンプル等の首都又は顕都に残存する故体及び岩 しくは異数を下方の副部に落下させるようにな し、第2の工程にかいて、放射部に存在する符 液内の具物を検査するようになし、両工程を送 統的にアンプル等が通過するように互いに近接 して配置するととを特徴とするアンブル。 アル等の検査方式
- 2 前記第1。の工程にかいて、アンブル等は比較 的高速で容易され、第2の工程にかいて比較的 低速で回転されるととを特徴とする特許請求の 範囲第1項にぞう方式 .
- 1. 前記第1の工程又は第1の工程と第2の工程 の接続工程にかいてアンブル寺の首部の鋭けと

4同時に行うように立した修計算求の集団第1

## 発明の評細を説明

太発明はアンプル等の茶液中に含まれている具 物(塩块)を検査するための新規を方式に関する

何えばアンプル内の薬放中に洗入した具物の検 主に歌し、昔遠、異物はアンブルの崖部に沈æし ているので、とれず彼中に拝进させるために、ア ンプルを高速回転させる方法が行われている。と のとき、日転数を3000 r.p.m. 和変に迅定すれ ピアンプル首都及び貢都に元まつた液を開部に落 下でき、楽弦全体の検査が可能であると共化。ア ンプルの首都や顕著に付着した具物を液中に浮遊 でき、正確な検査が可能である。

・更に、との回転は、映像法で異価を検索する場 合にも役立つている。即ち、具物はとの故の狂転 又とのほを投影するときには、アンプルの回転を

止め且つ。 七の時に彼の縁転はなか神統十る状態 にかけば、アンブル外面に付着した具物と液中の 具物と七分離して検出することもできる。

1

斯る方式に従つた従来装置の配置を終り図に示 してある。図中1は、円筒部に多数の切欠2を有 する回転台で、アンプルフィーダー3よりは切欠 2にアンプルイが送り込まれ、四示外の通覚をホ ルダーで保持される。前記回転台 1 は間歇的に回 転せられ、アンブルイは矢印人の如く非動せられ る。5及び8はブーリーであり、モーメー7との 間にペルト8が張られ、アンプル又はその保持具 はとのペルト8に圧接される。 而してモーメープ を国転させてかけば、アンブルは多数の途中にか いて、ペルト 8 に接し、高速回転 ( 3000 rpm ) が与えられる。とのペルトを造通したアンプルは、 次の段階にかいてその四転が停止される。 しかし 作ら内部の薬液は損性により依然として回転を統 ける。駄薬液の永回転しているアンプル仕次に提 象質9の位置、続いて10の位置に移動される。 鉄操像管 9 , 1 0 の夫々の位置にかいて、 図示外

特別 1151-20897(2)
のランプからアンプルに光が展射され、数アンプル及び内部展散等からの反射,散乱光が失々の機像管により検出される。前記機像管 8 社、重量異物の検出に役く立ち、又10 は能量異物の検出に役く立つ。失々の操像管からの信号は制御回路11に送られ、被検アンプルの良否を決定する。該制御回路は検出信号処理回路,計數団路,利定回路等を含んでかり設定値以上の異物が存在した場合。不良品書別機構12に信号を送り、不良品書拍出する。13 は良品アンブルの回収機構である。

との様を構成の装置によれば、一応アンプル内 の具物は自動的に検査され、内限による検査に比 し、正確で迅速であるという項点を有している。

しかし乍ら、本発明者の実験によれば従来最適とされていた3000 rpm程度の回転はアンプルの首部の被手下方に落下させるには役立つが液内具物の検出には高速すぎ、その再現性があまり良くないことが判明した。そして更に実験を重ねた結果液内異物の検出には1500 rpm程度の低速回転の方が再現性が著じるしく高いことが判明し

た。との事は特に操像管の前面に配置するレンズ 系の焦点器度がアンプルの直径全域をカパーする 物操くないとまや薬液の透明度が小さいとをには 観着である。

面して本発明は以上の事実に着目し、全検査工程を二つに分離し、第1の工程にかいて高速回転によるアンプル首都或いは顕都の敬体等下を行わしめ、第2の工程にかいて低速阻転による具物検出を行うととに特徴がある。本発明の一具体例として四転台が2個使用され、その一方にかいて、アンプルは3000 rpm程度の高速回転が与えられ、首都中国部に残存する業被が下方の原態に落下せられる。との答下処理の終つたアンプルは移送機によって他方の回転台に送られ、今度は1500 rpm程度の低速回転が与えられその後、提供管を使用して具物検出が行われる。

第2回は、上記方式に載った本発明の具体的配 世例を示するので、第1回と同符号は同一構成要 まを示してある。四中14は、円周部に複数値の 切欠ま15を有した第2の回転台でフィーダー3

よりアンプルイは先ずとの間転台に送り込まれ、 プーリー16、17、モーター18及びペルト19 から構成される貸板機構によつて 3000 cpm 相 度の高速回転が与えられる。計画転の終了したア ンプルは非送機20によつて回転台1の切欠ま 2 に移送される。モレてブーリー5、4、モーメー 7及びベルトをからなる回転機構によつて低速回 転され、操像管9及び10によつて異物検出が行 われる。第8回は数本発明方式にかけるアンプル の洗れ及び検査団路のプロック国を示してある。 図中一シはアンブルの沈れ。――」は光値。―― は 電気信号を示してある。同期中、極後性9及び10 からの出力信号は、信号処理電子回路21及び22 に送られ。放内兵物の大きさに対応した巾をもつ ペルス信号に変換される。放失人の電子回路の出 力信号はモニター2.3及び比較回路2.4。2.5 に 夫々送られる。 放比較回路には基準ペルス発生器 26から許容し存る異物の大きさに対応する巾の 基準ペルスが送り込まれており、前配検出され処 理されたパルスと比較される。 検出パルス市が基

単ペルス市より大きいとは飲出飲度回路よりペルス個号が発生され、計数回路27に送られる。飲計數回路にかいて、一定以上の計数がなされた場合、不良品辨験信号発生回路28に信号が送られ、選別機構12を作動せしめて、不良品は辨験される。

以上の如く本発明方式にかいては、被内具物の 金枝差工程を二つの主要部に分離し、終1の工程 にかいて、アンプル首部や顕都内の液を落下させ、 第2の工程にかいて具物検出を行つている為、夫 本最適な回転を与えることが可能となり、最物検 出の再現性が著じるしく向上し、従つて正確な検 査が可能となる。

又、回転台を2個用いるととにより比較的簡素を構造により初期の目的を達成することができる。 即ち、具物の検出に扱しては重い具物と軽い異物 とでは、これらの具物が被の回転に使つて浮上した後、沈降する速度が著じるしく異るため、前名 の検出はアンブルの回転停止後、比較的短かい時間内に実行し、後者はかなりの時間経過後実行す 福岡 昭51-20897 (3)

る必要がある。それ故、第1 因及び第2 図に示す 如く操像管 9 と 1.0 は相当に難して配置してある。 然るに、低速回転機構に加えて一つの回転台の周 りに高速回転機構を付加するときは、最初に実施 されるアンブルの首部内の液を落下せしめる工程 にかける高速回転の影響が發取の低速回転に及ば ないようにしなければならないので、両回転機構 は充分な関係を促つて配置されればならない。 徒 つて回転台の寸法は必然的に大きくなり、 英雲の 設置に大きな制約を受ける。 これに対し、 本発甲 方式では回転台が2 個用いられ、二つの工程が全 く分離されているため、上配の身害は生じない。

更に、第2 即中点離2 8 で示す如くアンブル移送部に検査装置を配置し、具物検査以外の検査、例えばアンブル首部における続けこげ、対止部分の静閉不良、対止部分のおりととができる。これらの検表項目は、アンブルの首部中限部に関係するものであり、軌道の回転台を用いての異物検査に終しては駄首部が保持体で必要されてしまうので検査できないが、前

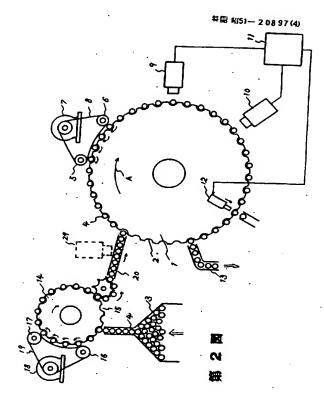
述の如く参送部分を利用されば風影構造物がない ので具物検査の途中にかいて他の検査を行うとと ができ、集中的検査が連成され極めて効率的であ る。

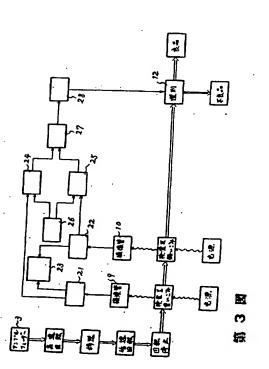
微、上記は本発明の例示であり、実用にあたつては色々な変更が可能である。例えば、上記では 二つの認転台1と14を利用したが、直縁的に移動するものであつてもよい。又、アンブルに回転を与える機構としては様々考えられ、ブーリーとペルトによるものに限定されるものではない。 認面の簡単な説明

第1回は従来の方式を説明する為の配置図、第 2回は本発明の方式に従つた配置図、第8回はア ンプルの能及び検査手収の等気回路を示すプロッ ク銀図である。

第2回に於て、1は回転台、2はその円層部に 設けられた切欠者、3はアンプルフィーダー、4 はアンプル、5及び6はプーリー、7はモーター、 8はベルト、9及び10は換像管、11は前側回 略、12は不良品週別機構、13は良品アンプル 回収機構、14は回転台、15はその円局部に設けられた切欠き、16及び17はブーリー、18 はモーター、19はペルト、20は移送機である。

> 等 許 出 窟 人 日本電子株式会社 代表者 具 戸 健 二





6. 前配以外の発明者 在所 東京都昭島市中村町1418者地 日本電子株式会社内 氏名 井 上 優 一

BEST AVAILABLE COPY